

電子部品の X 線透過観察

電子部品・実装部品等の不具合解析は、X 線での非破壊観察を行うことが基本です。多くの場合、およその不具合状況を把握することが可能です。

マイクロフォーカスX線透過装置の概要



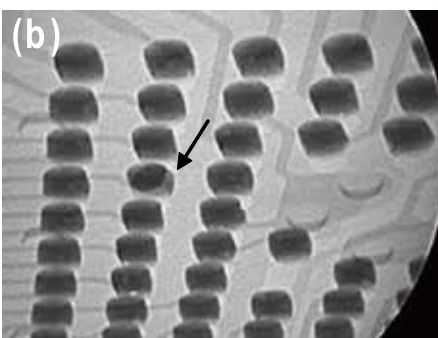
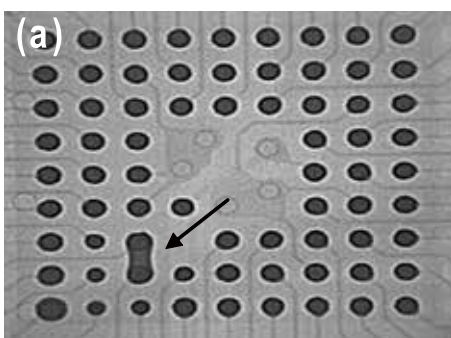
仕様

- ・分解能 : 2 μ m
- ・最高倍率 : 1800 倍
- ・ステージ寸法 : 300×250mm (2kg まで)

特長

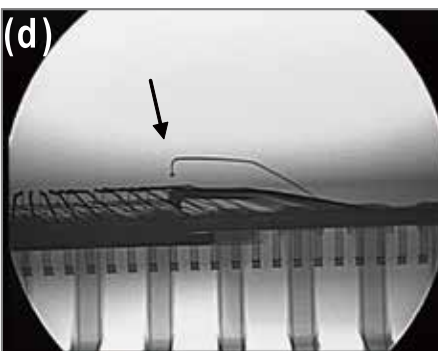
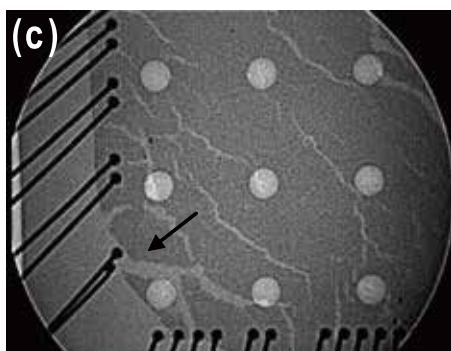
- ・試料の X,Y,Z, 移動、回転、傾けが可能な 5 軸マニピュレータを搭載しています。

X線透過観察の例



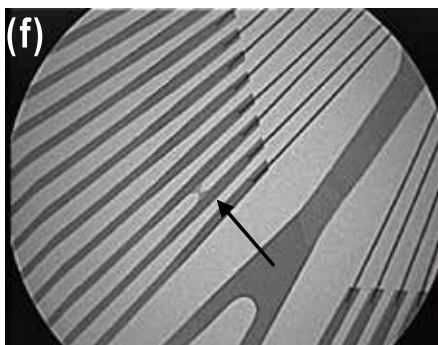
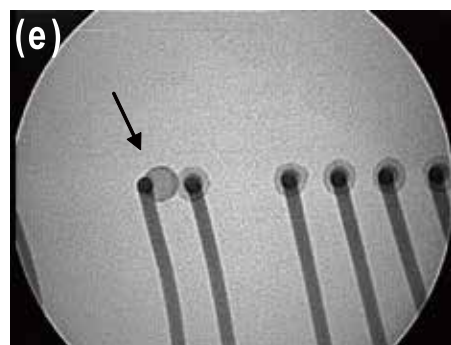
(a) フリップチップ
実装のショート不良

(b) フリップチップ
実装のオープン不良



(c) QFP パッケージ 1st
ボンドの 異常部

(d) QFP パッケージ 1st
ボンドの異常部を
横から観察



(e) QFP パッケージ 1st
ボンドの 異常部

(f) QFP パッケージ
インナーリードの
異常部

お問い合わせは
こちらまで

株式会社アイテス
品質技術部

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅 800 番地
TEL: 077-599-5020 FAX: 077-587-5901
URL: <http://www.ites.co.jp>